**Сведения об официальном оппоненте**

|  |  |
| --- | --- |
| Фамилия, имя, отчество | **Решетов Владимир Николаевич** |
| Ученая степень | доктор физико-математических наук |
| Научная специальность, по которой оппонентом защищена диссертация | 01.04.07 Физика конденсированного состояния |
| Ученое звание | доцент |
| Полное наименование организации | **Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»** |
| Адрес, телефон, электронная почта | 115409 г. Москва, Каширское шоссе, д. 31  тел.: +7 (903) 732-57-02  e-mail: [nreshetov@yandex.ru](mailto:nreshetov@yandex.ru) |
| Должность | доцент кафедры электронных измерительных систем |
| Основные публикации официального оппонента по теме диссертации в рецензируемых научных изданиях за последние 5 лет | 1. I. Maslenikov, A. Useinov, A. Birykov and V. Reshetov Reducing the influence of the surface roughness on the hardness measurement using instrumented indentation test // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 2017 Vol. 256, No. 1.  2. T. V. Kazieva, A. P. Kuznetsov, K. L. Gubskiy, V. N. Reshetov, M. V. Ponarina, A. S. Antonov, A. S. Useinov. SPM metrological assurance using a heterodyne interferometer // SCANNING MICROSCOPIES 2015, 2015 Vol. 9636.  3. I. I. Maslenikov, V. N. Reshetov, A. S. Useinov. Mapping the elastic modulus of a surface with a NanoScan 3D scanning microscope // Instruments and Experimental Techniques, 2015 Vol. 58, No. 5, Q3 pp. 711-717.  4. I. I. Maslenikov, V. N. Reshetov, B. A. Loginov, A. S. Useinov. Mapping of mechanical properties of nanostructured materials using a piezoresonance probe // INSTRUMENTS AND EXPERIMENTAL TECHNIQUES, 2015 Vol. 58, No. 3, Q3 pp. 438-443.  5. Т. В. Казиева, А. П. Кузнецов, К. Л. Губский, В. Н. Решетов. Разработка трехкоординатного гетеродинного лазерного интерферометра для метрологического обеспечения сканирующих зондовых микроскопов // Физическое образование в ВУЗах, 2015г. Vol. Т. 21, No. N 1С Стр. 52.  6. T. V. Kazieva, A. P. Kuznetsov, K. L. Gubskiy, V. N. Reshetov. Three-coordinate laser heterodyne interferometer for metrological assurance of scanning probe microscopes // Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering, 2014 Vol. 9442. |